

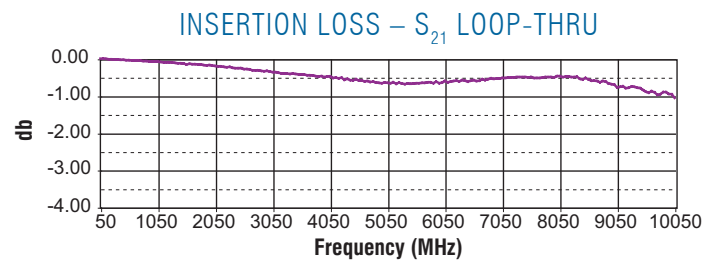
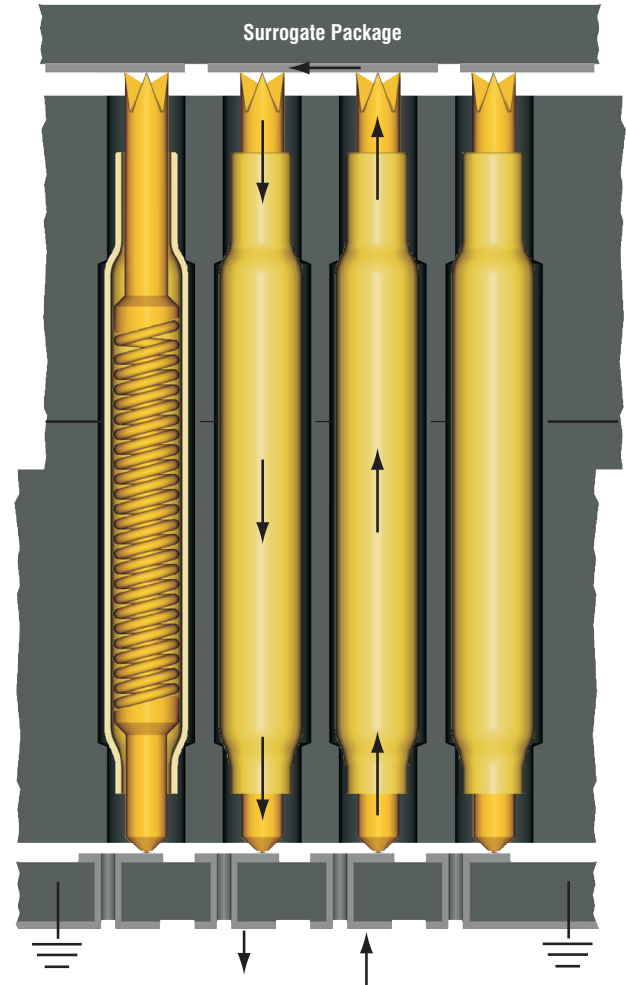


M08-89系列的高频性能

测试接触器的高频性能在高速测试设备中非常重要。QA Technology已进行在用M08-PRG89探针填充的替代测试接触器上进行高频测量。QA使用微波网络分析仪和定制测试夹具在多种配置中测试接触器。

对于环通测量，测试信号通过测试板通孔和第一个探针到达替代封装。代理封装上的隔离迹线将信号耦合到相邻探针，在那里信号通过第二测试板通孔返回。两个信号传输探针周围的所有探针均接地。

如插入损耗图所示，所述环路通过信号路径实现了10GHz的-1db带宽。



Bandwidth: -1 db @ 10.0 GHz
Self Inductance: 1.13 nH